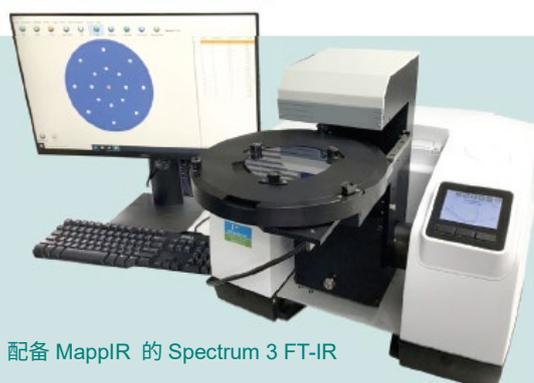


质量保证 精益求精

采用 MappIR 进行晶圆测试和分析

参与晶圆设计和制造的管理者的任务很多都包含提供高效流程和保证高质量的生产运行效率，以最终满足客户的产品规格和需求。您或许经常会因为仪器设备不能得到可靠的测试结果而遇到各种挑战，比如导致生产中断、缺乏信心或者复杂设备不易于使用而需要全面的培训。

Spectrum 3™ FT-IR 搭配 MappIR，有助于确保质量，降低不良率，高效检出并排除杂质影响，按时准确交付生产成果。无论是提高最终产品的均一性和降低前端制造中的不良率，还是评估和验证掺杂度以保持和优化生产工艺，MappIR 具有易于使用的界面，仅需最简单的培训，可为您提供可信赖的快速和准确的结果。



配备 MappIR 的 Spectrum 3 FT-IR

前端制造

- 材料鉴定
- 固化验证
- 评估芯片缺陷的测试
- 污染物或颗粒物检测

后端组装

- 最终硅晶圆质量保证/质量控制测试
- 缺陷分析

要了解 MappIR 晶圆分析的更多信息，请访问：www.perkinelmer.com/mappir

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司
地址：上海张江高科技园区张衡路 1670 号
邮编：201203
电话：021-60645888
传真：021-60645999
www.perkinelmer.com.cn



欲获悉全球办事处的完整清单，请登录 www.perkinelmer.com/ContactUs

版权所有©2021 珀金埃尔默公司。保留所有权力。PerkinElmer®是珀金埃尔默公司的注册商标。所有其他商标属于相应所有者的财产。